

致各位

公司名 尼得科精密检测科技株式会社

代表人 董事长 山崎秀和

所在地 京都府向日市 Nidec Park 33 番地 C 栋

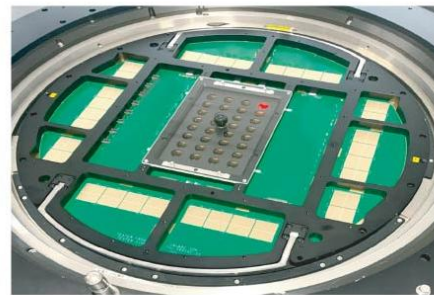
尼得科精密检测科技将亮相“SEMICON KOREA 2026”

尼得科精密检测科技株式会社（以下简称“本公司”）将参展 2026 年 2 月 11 日（周三）～2 月 13 日（周五）于韩国首尔 COEX 会议中心举办的“SEMICON KOREA 2026”。

本次展会将展出助力下一代功率半导体 (IGBT/SiC) 市场的检测设备“NATS 系列”以及汇总了集团技术的最新检测解决方案。



NATS-1304



2D MEMS 探针卡

本公司子公司尼得科 SV Probe 将首次在韩国展出品圆检测夹具“探针卡”的最新解决方案，包括可实现半导体器件温度测量的 TC (Thermo Couple: 热电偶) 探针，以及采用 2D MEMS 技术的探针卡等产品。

此外，我们还将展示本公司核心产品半导体封装基板电气检测系统“GATS 系列”的最新机型。

〈参展概要〉

- 展期: 2026 年 2 月 11 日 (周三) ~ 2 月 13 日 (周五)
- 会场: 首尔市 COEX 会议中心
- 展位: 1 楼 Hall Grand Ballroom G004
- 官网: <https://www.semiconkorea.org/en>

〈展品及 Panel 展示内容〉

- 2D-MEMS 探针卡
- 垂直型 高电流 PROBE
- 器件温度测量 PROBE
- 玻璃微孔加工
- IGBT/SiC 模块用绝缘/静态特性/动态特性检测设备 “NATS-1000/1700 系列”
- KGD 测试装置 “NATS-1300 系列”
- RWi-300MK (wafer AOI)
- AC/DC 多功能测试仪 “R-700 系列”
- AI 服务器大型电路板电气检测系统 “GATS-8360”
- 超高精度检测用针式探针